

第80回分析基礎セミナー

実践！機器分析【2】

X線分析

【日時】 2014/5/14（水） 13:00-17:00（受付12:30～）
【場所】 九州大学伊都キャンパス・西講義棟 3階第3講義室
【主催】 九州大学中央分析センター伊都分室
【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム
【協力】 株式会社リガク、株式会社島津製作所、株式会社東陽テクニカ

13:00-14:15 「X線回折を中心とした粉末・薄膜材料評価」

X線回折をメインに粉末・薄膜材料を対象とした測定/解析を原理や評価例を用いてご紹介する。

14:15-15:15 「X線回折分析における定量分析の実際」

X線回折で行われる定量分析の各種手法およびそれらの定量精度や限界について、実際の分析例を用いて解説します。

15:15-15:30 休憩

15:30-17:00 「X線マイクロCTの基礎と実際」

X線マイクロCTの原理から装置に関して詳しく解説します。
また今回、中央分析センター伊都分室にBruker製マイクロCT「SkyScan 1172」が設置されましたので、本装置の紹介も併せて行います。

分析基礎セミナーは今年で8年目です。今年度は、基礎に加えて実際にデータを取得する上で役立つ内容に重点をおきます。現場で困っている方、よりよいデータを取得されたい方にも有用です。今回のX線分析では基礎や原理に加えて、定量分析に関しても知識が得られる内容です。X線マイクロCTは今年度から共同利用機器に加わりました。ぜひご利用ください。
学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。途中入退室も自由ですので都合に合わせてご参加ください。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp